

G 01 N 21/21

Ans.nr.: 2267/85

Indleveret: 22 maj 1985

Løbedag: 22 maj 1985

Alm. tilgængelig: 25 nov 1985

Prioritet: 24 maj 1984 DE 3419463

*SAGAX INSTRUMENT AB; Sundbyberg, SE.

Opfinder: Niels Arvid Norman *Bjoerk; SE, Erland Torbjoern *Sandstroem; SE, Johan Emanuel *Stenberg; SE, Lars Bertil *Stibler; SE.

Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf.

Ellipsometrisk fremgangsmåde og apparat til undersøgelse af fysiske egenskaber

S a m m e n d r a g

2267-85

En ellipsometrisk fremgangsmåde og et ellipsometer til undersøgelse af fysiske egenskaber for prober, særligt probeoverflader, henholdsvis overfladelag af prober, hvorved under probemålingen vinkelindstillingerne for polarisatoren(2) og analysatoren(5) forbliver fast indstillede, to eller flere diskrete, indbyrdes forskellige, forudbestemte polarisationstilstande for strålingen mellem polarisatoren(2) og proben(3) og/eller mellem proben(3) og analysatoren(5) bliver indstillet ved hjælp af polarisationsmodulatorelementer(41,42,43,44), der er anbragt i strålebanen, og intensiteten af den i analysator(5) polariserede stråling måles ved hver diskret polariseringstilstand og udnyttes i en datamat (8) til bestemmelse af polarisationsegenskaberne for proben.

2267-85

